

●線雷射交叉型可用3條雷射線進行一次性 掃描,即使是複雜形狀也可有效率的量 測。(SurfaceMeasure 606T的情形)

減少測頭角度變更次數以「提高量測效率」

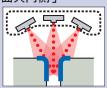




無角度變更

可作雷射選擇

從3方向作同時掃描,「同時量測上 面與內側」



雷射從斜3方向往 中心方向照射。

●飛點式在邊際部份的量測上實現了極高的 形狀重現性,且達成同等級最高的掃描精 度。(SurfaceMeasure 201FS的情形)



## 座標測定機

●能量測三次元,最先進精密量測技術的結晶

# 非接觸式雷射測頭

## SurfaceMeasure

### ●超高速收集資料

SurfaceMeasure是將雷射照射於工件並移動, 以收集工件表面之座標值的測頭。可進行 75.000點/秒※的超高速資料收集。

※使用SurfaceMeasure 606/610/1010時

#### ●非接觸式的好處

因不作接觸,所以亦可量測樹脂、細薄零件等以接觸式量測時會變形的彈性物體。

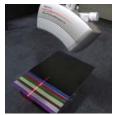
## ●無粉末量測

配合環境及工件材質自動設定雷射強度和攝影機靈敏度,實現無噴灑粉末的量測。 提供更簡單、更優質的雷射掃描環境。

## ●評估案例

藉由豐富的選購軟體,將所收集的點群資料活用於各種用途,如與各種編輯、面生成、 CAD資料進行比對,或是CAD資料化等。







彩色樣本板的量測

有光澤物體的量測







403/606/610/1010

606T

201FS

## ■規格

		Surface Measure 403 × 1	Surface Measure 606	Surface Measure 610	Surface Measure 1010	Surface Measure 606T	Surface Measure 201FS
雷射照射方式		單一線雷射				交叉線雷射	飛點
量測寬度		40mm	60mm	60mm	最大100mm	3×65mm	最大23mm
量測深度		30mm	60mm	100mm	100mm	65mm	15mm
工作距離		66mm	123mm	165mm	165mm	203.5mm	57.5mm
掃描誤差 ※2		8µm	12µm	15µm	18µm	17µm	1.8µm
資料取得速度		60,000點/秒	75,000點/秒			3×25,500點/秒	25,000點/秒
重量		430g	430g	400g	400g	480g	500g
雷射等級	EN/IEC	Class2 [ EN/IEC 60825-1(2007) ]					
	JIS	Class2 [ JIS C 6802 : 2011 ]					
	媒體	紅色半導體雷射					半導體雷射
量測用雷射	波長	660nm					670nm
	輸出	4mW					1mW
引導用雷射	波長	— 635nm				_	
り、学用曲別	輸出	1mW				_	

※1:此為特注品。

※2:依本公司指定檢查法。(1σ/球量測)、測針單體誤差

